PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 2000-307287

(43)Date of publication of application: 02.11.2000

(51)Int CL H05K 9/00

> H01F 1/37 H01F 27/33

(71)Applicant : TOKIN CORP (21)Application number: 11-114876

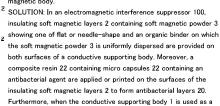
(22)Date of filing: 22.04.1999 (72)Inventor: AWAKURA YOSHIO YOSHIDA EIKICHI

(54) ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE SUPPRESSOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To lengthen the lifetime of an electronic device itself and to expand application part by using a composite magnetic body containing soft magnetic powder and organic binder. and by imparting the antibacterial property to the composite

magnetic body.



constituent, one of a conductor plate, a mesh-like conductor plate or fabric made of conductive fiber is selected to use as the conductive supporting body 1. Thus, the lifetime of an electronic device itself can be lengthened and application parts can be expanded.

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1]An electromagnetic—compatibility repressor characterized by giving antibacterial properties to said compound magnetic substance in an electromagnetic—compatibility repressor which deters an electromagnetic wave noise using a compound magnetic substance containing soft magnetic powder and an organic binder.

[Claim 2]An electromagnetic-compatibility repressor, wherein it presents said antibacterial properties by an antibacterial layer formed in the surface of said compound magnetic substance in the electromagnetic-compatibility repressor according to claim 1 and said antibacterial layer becomes substantial from what fixed a microcapsule containing an antimicrobial agent with a synthetic resin.

[Claim 3]An electromagnetic-compatibility repressor presenting said antibacterial properties in the electromagnetic-compatibility repressor according to claim 1 with an antimicrobial agent contained inside said compound magnetic substance.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention]This invention relates to the electromagnetic-compatibility repressor used in order to control the electromagnetic interference produced by interference of unnecessary electromagnetic waves in a high frequency region.

[0002]

[Description of the Prior Art]In recent years, spread of the communication equipment which the electronic equipment which begin digital electronic equipment and use high frequency has spread, and use a quasi microwave band region especially is remarkable. For example, especially the mobile communications equipment represented by the cellular phone has the remarkable demand of a miniaturization and a weight saving, and high-density-assembly-ization has been the biggest technical problem.

[0003]Therefore, since improvement in the speed of the signal processing speed is also attained by the electronic parts and the printed wiring which were mounted overcrowded, in them, the interference by the increase and radiated noise of combination between lines by electrostatic **** inductive coupling, etc. arose, and the situation which bars normal operation of electronic equipment has arisen not a little in them. The adverse effect to such electronic equipment is called what is called electromagnetic wave disorder.

[0004] The inductive coupling and the spurious radiation noise which provide means, such as keeping away the circuit which acts to a circuit as ** people of the low pass filter to electromagnetic wave disorder conventionally, or poses a problem, or performing shielding, and cause electromagnetic wave disorder are

controlled. After closing the active device itself by resin, the policy of shielding by conductive paste etc. and covering an active device to spurious radiation is considered. However, the measure to the conventional electromagnetic wave disorder was provided with various faults, and was not necessarily practical.

[0005]There are the compound magnetic substance and electromagnetic-compatibility repressor which were indicated by JP,7-212079,A (it is called the conventional technology 1) to solve this fault. This electromagnetic-compatibility repressor consists of a compound magnetic substance containing soft magnetic powder and an organic binder, and receives the penetration of electromagnetic waves. Have a shielding effect equivalent to a conductive shield material, and reflection of electromagnetic waves is received. The electronic device itself is improved instead of not making inductive coupling by reflection promote at least, and using a filter etc., It has the advantage that malfunction by the noise easily emitted to the exterior from a wiring board, the mutual interference between the parts inside a wiring board, or the electromagnetic induction between signal wires can be controlled.

[0006]

[Problem(s) to be Solved by the Invention]By the way, depending on selection of the organic binder contained in the compound magnetic substance which constitutes the electromagnetic-compatibility repressor mentioned above, it deteriorates and discolors by bacteria or mold, the function of an electromagnetic-compatibility repressor is spoiled, and there is a fault of shortening a life.

[0007]There are some for which health nature is needed in the use which uses an electromagnetic-compatibility repressor.

[0008]Therefore, antibacterial properties. By using it for the part for which electronic equipment used for the part in contact with the hand of persons, such as a switch and remote control parts, such as a portable mobile phone etc. and telephone, and health nature are needed by the given electromagnetic—compatibility repressor, The life of electronic equipment itself can be prolonged, expansion of a use part can be aimed at, and the demand of electromagnetic—compatibility repressors can be increased.

[0009]So, there is a technical technical problem of this invention in providing the electromagnetic-compatibility repressor to which antibacterial properties were given.

[0010]

[Means for Solving the Problem]According to this invention, in an electromagnetic-compatibility repressor which deters an electromagnetic wave noise, an electromagnetic-compatibility repressor giving antibacterial properties to said compound magnetic substance is obtained using a compound magnetic substance containing soft magnetic powder and an organic binder.

[0011]According to this invention, in said electromagnetic-compatibility repressor, said antibacterial properties are presented by an antibacterial layer formed in the surface of said compound magnetic substance, and an electromagnetic-compatibility repressor, wherein said antibacterial layer becomes substantial from what fixed a microcapsule containing an antimicrobial agent with a synthetic resin is obtained.

[0012]According to this invention, in said electromagnetic-compatibility repressor, an electromagnetic-compatibility repressor presenting said antibacterial properties with an antimicrobial agent contained inside said compound magnetic substance is obtained.

[0013]

[Embodiment of the Invention]Hereafter, an embodiment of the invention is described with reference to drawings

[0014] Drawing 1 is a sectional view showing the electromagnetic-compatibility repressor by a 1st embodiment of this invention. If drawing 1 is referred to, the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 1st embodiment of this invention, At the point of having the conductive substrate (or conductive soft magnetism base material which has soft magnetism) 1, and the insulating soft magnetic material layer 2 of this conductive substrate 1 provided in the field (drawing 1 both sides) on the other hand at least, it is the same as that of conventional technology.

[0015]The electromagnetic-compatibility repressor 100 by an embodiment of the invention differs from what is the point of having spreading or the antibacterial layer 20 which carried out print formation, and twists the synthetic resin 22 which contains further the microcapsule 21 containing an antimicrobial agent on the surface to conventional technology.

[0016] In this electromagnetic-compatibility repressor 100, the insulating soft magnetic material layer 2 contains the soft magnetic material powder 3 which presents flat shape or one shape of needlelike inside, and the organic binder 4 in which the soft magnetic material powder 3 is distributed uniformly.

[0017]In the electromagnetic-compatibility repressor 100, in making the conductive substrate 1 into a component, one of a conductive material plate, a mesh shape conductive material plate, or the textiles of a conductive fiber is chosen, and it uses the conductive substrate 1, for example. In making the conductive soft magnetism base material 1 into a component, one of the textiles of a soft magnetism metal plate, a mesh shape soft magnetism metal plate, or a soft magnetism metal fiber is chosen, and it uses the conductive soft magnetism base material 1.

[0018] Drawing 2 is a sectional view showing the electromagnetic-compatibility repressor by a 2nd embodiment of this invention. As shown in drawing-2, the electromagnetic-compatibility repressor 100 contains the conductive thin film 6 in which vacuum evaporation membrane formation of the conductive substrate (or conductive soft magnetism base material which has soft magnetism) 1 was carried out in at least one field of the insulating base material 5 and this insulating base material 5. Although drawing-2 showed as an example the conductive thin film 6 by which vacuum evaporation membrane formation was carried out to both sides of the insulating base material 5, vacuum evaporation membrane formation of the conductive thin film 6 may be carried out in the one direction of the insulating base material 5. On the conductive thin film 6, the insulating soft magnetic material layer 2 shown in drawing-1 and the same insulating soft magnetic material layer 2 are formed, and it has the antibacterial layer 20 on the surface, respectively.

[0019]When ******* explanation of the electromagnetic-compatibility repressor 100 of a 3rd embodiment is given at drawing.2, as for the electromagnetic-compatibility repressor 100, the conductive substrate (or conductive soft magnetism base material for which it has soft magnetism) 1 contains the soft magnetism metal thin film 7 of the insulating base material 5 and this insulating base material 5 by which **** membrane formation was carried out at least on the other hand in the field. Although drawing.2, showed as an example the soft magnetism metal thin film 7 by which vacuum evaporation membrane formation was carried out to both sides of the insulating base material 5, vacuum evaporation membrane formation of the soft magnetism metal thin film 7 may be carried out in the one direction of the insulating base material 5. On

the soft magnetism metal thin film 7, it has the same insulating soft magnetic material layer 2 and scented layer 20 as the insulating soft magnetic material layer 2 shown in drawing 1.

[0020] <u>Drawing 3</u> is a sectional view showing the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 4th embodiment of this invention. If <u>drawing 3</u> is referred to, as for the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 4th embodiment of this invention, the conductive substrate 1 will consist of the conductive powder 8 and the organic binder 4. The insulating soft magnetic material layer 2 shown in the field by <u>drawing 1</u> on the other hand at least, the same insulating soft magnetic material layer, and the antibacterial layer 20 of this conductive substrate 1 are provided.

[0021] Drawing 4 is a sectional view showing the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 5th embodiment of this invention. As shown in <u>drawing 4</u>, the conductive substrate 1 has the conductor layer 9 provided on at least one field of the insulating base material 5 and this insulating base material 5, and the antibacterial layer 20 provided on it. The insulating soft magnetic material layer 2 shown by <u>drawing 1</u> and the same insulating soft magnetic material layer are provided in the conductor 9 of this conductive substrate 1, and other fields. After providing the insulating soft magnetic material layer 2 and the same insulating soft magnetic material layer on the conductor 9, the antibacterial layer 20 may be formed on an insulating-substrate side or an insulating soft magnetic material layer.

[0022]Drawing 5 and drawing 6 are the sectional views showing the electromagnetic-compatibility repressor 100 by 6th and 7th embodiments, respectively. As shown in drawing 5 and drawing 6, the electromagnetic-compatibility repressor 100. It has the conductive substrate (or conductive soft magnetism base material which has soft magnetism) 1, the insulating soft magnetic layer 2 of the conductive substrate 1 provided in the field on the other hand at least, the dielectric layer 10 of the insulating soft magnetic material layer 2 provided in the field on the other hand at least, and the antibacterial layer 20 provided on it.

[0023]The insulating soft magnetic material layer 2 contains the soft magnetic material powder 3 and the organic binder 4 which present flat state or the shape of a needle. The dielectric layer 10 contains the dielectric powder 11 and the organic binder 4. Namely, as for the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 6th embodiment shown in drawning.5, the insulating soft magnetic material layer 2 intervenes between the conductive substrate 1 and the dielectric layer 10.

[0024] <u>Drawing 6</u> is a sectional view showing the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 7th embodiment. As for the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 7th embodiment shown in <u>drawing 6</u>, the dielectric layer 10 intervenes between the conductive substrate 1 and the insulating soft magnetic material layer 2. The antibacterial layer 20 is formed in the outside of the insulating soft magnetic material layer 2.

[0025] Drawing 7 is a figure showing the electromagnetic-compatibility repressor 100 by an 8th embodiment of this invention. As shown in drawing 7, the electromagnetic-compatibility repressor 100 by an 8th embodiment has the conductive substrate (or conductive soft magnetism base material which has soft magnetism) 1, the insulating soft magnetic material layer 2 of this conductive substrate 1 provided in the field on the other hand at least, and the antibacterial layer 20 provided on it. The insulating soft magnetic material layer 2 contains the soft magnetic material powder 3, the dielectric powder 11, and the organic binder 4 which present flat state or the shape of a needle.

[0026]In each above-mentioned embodiment, it can be used as the conductive substrate 1, being able to choose - ** of a conductive material plate, a mesh shape conductive material plate, or the textiles of a conductive fiber. It can be used as a conductive soft magnetism base material, being able to choose one of the textiles of a soft magnetism metal plate, mesh shape soft magnetism metal temporary, or a soft magnetism metal fiber

[0027]As a concrete example of the conductive substrate 1, what is called a punching metal that performed the detailed perforating process to metallic thin plates, such as **, a copper thin plate, stainless steel sheet metal, and aluminum sheet metal, and them, or thin. — the conductor of what is called an extract band metal that carried out the stretching process, or thin line state, after giving a detailed break temporarily. It is the wire gauze etc. which were processed into mesh shape.

[0028]What is necessary is just to replace with a permalloy or iron-silicon steel etc. in which only construction material presents soft magnetism with the same gestalt as a concrete example of the conductive soft magnetism base material 1. In this case, the high electromagnetic-compatibility depressor effect in comparatively low frequency is expectable. Anyway, choosing according to a use is desirable.

[0029]It can do [mentioning an iron aluminum silicon alloy with big high frequency amplitude permeability (Sendust), and an iron nickel alloy (permalloy) as the typical raw material as the soft magnetic material powder 3, or]. Detailed disintegration of the soft magnetic material powder 3 is carried out, and a surface portion is used for it, oxidizing. The aspect ratio of the soft magnetic material powder B is desirable in a thing large (5:1 or more [About]) enough.

[0030]As the organic binder 4. Thermoplastics, such as **, polyester system resin, polyvinyl chloride system resin, polyvinyl butyral resin, polyurethane resin, cellulose type resin, nitril butadiene series rubber, and styrene butadiene series rubber, or those copolymers, an epoxy resin, phenol resin, Thermosetting resin, such as amide system resin and imide system resin, etc. can be mentioned.

[0031]Metal, a magnetic metal, conductive carbon, an organic conductor, etc. to one side or both sides, such as a polyimide substrate, as the insulating base material 5 with vacuum deposition, such as a sputtering technique, the true ****** method, and a chemical-vacuum-deposition (CVD) method. It can use as a conductive substrate which also uses for this invention the conductive base material or the conductive magnetic substrate which formed membranes.

[0032]The end of fine metallic powder, such as silver dust and copper powder, or conductive carbon black, conductive titanium oxide, etc. with the organic binder 4. To one side or both sides of the insulating base material 5, such as a polyimide substrate, without [the thing which kneaded and distributed and sheet–ized this, or] forming a direct sheet by the doctor blade method, the gravure coating method, the reverse coat method, or other means. What formed membranes can be used as the conductive substrate (or conductive soft magnetism base material) 1.

[0033]As the dielectric powder 11 used for the dielectric layer 10 which is another component of this invention described by a 6th embodiment, or the insulating soft magnetic material layer 2, what has the frequency characteristic of large **** and a dielectric constant whose dielectric constant in a high frequency region is comparatively flat is preferred. As an example, barium titanate series ceramics, titanic acid zirconic acid system ceramics, CHI evening N acid zirconic acid system ceramics, lead perovskite system ceramics, etc. can be mentioned.

[0034]It consists of the microcapsule 21 which constitutes the antibacterial layer 20, and a synthetic resin containing these. The microcapsule 21 consists of the cyclodextrin clathrate compound and ACP of an antimicrobial agent which consist of a cyclodextrin clathrate compound of the antimicrobial agent which has vaporization nature, or have vaporization nature as shown in JP,8-299422.A. As an antimicrobial agent used for this microcapsule, Isothiocyanine acid allyl, hinokitiol, hiba oil, Alpinia speciosa oil, a peignee royal, lemon grass, lemon, spike lavender, a nutmeg, oregano, a sage, a ginger, a savory, thyme, allspice, SHIDA wood, a cinnamon bark. Clove BAZZU, KAYUBUTE, a pinapolle, a tea tree, terpenes, etc., are mentioned.

[0035]The antibacterial layer 20 is formed by making polymer resin, for example, ultraviolet curing nature resin, contain these microcapsules 21, being applied or printed and stiffening the electromagnetic-compatibility control surface.

[0036] Drawing 8 is a sectional view showing the electromagnetic-compatibility repressor by a 9th embodiment of this invention. If drawing 8 is referred to, the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 9th embodiment of this invention, At the point of having the conductive substrate (or conductive soft magnetism base material which has soft magnetism) 1, and the insulating soft magnetic material layer 25 of this conductive substrate 1 provided in the field (drawing 1 both sides) on the other hand at least, it is the same as that of conventional technology. However, the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 9th embodiment of this invention is the point which constitutes the insulating soft magnetic material layer 25 which contained the antimicrobial agent 30 in the insulating soft magnetic material layer 2, and differs from what is depended on conventional technology.

[0037]In this electromagnetic-compatibility repressor 100, the insulating soft magnetic material layer 25 contains the soft magnetic material powder 3 which presents flat shape or one shape of needlelike inside, the organic binder 4 in which the soft magnetic material powder 3 is distributed uniformly, and the antimicrobial agent 30.

[0038]In the electromagnetic-compatibility repressor 100, in making the conductive substrate 1 into a component, one of a conductive material plate, a mesh shape conductive material plate, or the textiles of a conductive fiber is chosen, and it uses the conductive substrate 1, for example. In making the conductive soft magnetism base material 1 into a component, one of the textiles of a soft magnetism metal plate, a mesh shape soft magnetism metal plate, or a soft magnetism metal fiber is chosen, and it uses the conductive soft magnetism base material 1.

[0039] Drawing 9 is a sectional view showing the electromagnetic-compatibility repressor by a 10th embodiment of this invention. As shown in drawing 9, the electromagnetic-compatibility repressor 100 contains the conductive thin film 6 in which vacuum evaporation membrane formation of the conductive substrate (or conductive soft magnetism base material which has soft magnetism) 1 was carried out in at least one field of the insulating base material 5 and this insulating base material 5. Although drawing 9 showed as an example the conductive thin film 6 by which vacuum evaporation membrane formation was carried out to both sides of the insulating base material 5, vacuum evaporation membrane formation of the conductive thin film 6 may be carried out in the one direction of the insulating base material 5. On the conductive thin film 6, the insulating soft magnetic material layer 25 shown in drawing 8 and the same insulating soft magnetic material layer 25 are formed, and it is the thing to which antibacterial properties are given, respectively.

[0040]When ****** explanation of the electromagnetic-compatibility repressor 100 of an 11th embodiment is given at drawing 9, as for the electromagnetic-compatibility repressor 100, the conductive substrate (or conductive soft magnetism base material for which it has soft magnetism) 1 contains the soft magnetism metal thin film 7 of the insulating base material 5 and this insulating base material 5 by which **** membrane formation was carried out at least on the other hand in the field. Although drawing 9 showed as an example the soft magnetism metal thin film 7 by which vacuum evaporation membrane formation was carried out to both sides of the insulating base material 5, vacuum evaporation membrane formation of the soft magnetism metal thin film 7 may be carried out in the one direction of the insulating base material 5. On the soft magnetism metal thin film 7, it has the insulating soft magnetic material layer 25 shown in drawing 9, and the insulating soft magnetic material layer 25 shown in drawing 9, shown

[0041]Drawing 10 is a sectional view showing the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 12th embodiment of this invention. If drawing 10 is referred to, as for the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 12th embodiment of this invention, the conductive substrate 1 will consist of the conductive powder 8 and the organic binder 4. The insulating soft magnetic material layer 25 of this conductive substrate 1 shown by drawing 8, on the other hand at least and the insulating soft magnetic material layer 25 containing the same antimicrobial agent are formed in a field.

[0042]Drawing 11 is a sectional view showing the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 13th embodiment of this invention. As shown in <u>drawing 11</u>, the conductive substrate 1 has the conductor layer 9 provided on at least one field of the insulating base material 5 and this insulating base material 5. The insulating soft magnetic material layer 25 shown by <u>drawing 8</u> and the same insulating soft magnetic material layer are provided in at least one field of this conductive substrate 1 or the conductor 9.

[0043] <u>Drawing 12</u> and <u>drawing 13</u> are the sectional views showing the electromagnetic-compatibility repressor 100 by 14th and 15th embodiments, respectively. As shown in <u>drawing 12</u> and <u>drawing 15</u>, the electromagnetic-compatibility repressor 100. It has the conductive substrate (or conductive soft magnetism base material which has soft magnetism 1, the insulating soft magnetic material layer 25 provided in at least one field of the conductive substrate 1, and the dielectric layer 26 provided in at least one field of the insulating soft magnetic material layer 25.

[0044]The insulating soft magnetic material layer 25 contains the soft magnetic material powder 3 and the organic binder 4 which present flat state or the shape of a needle, and the antimicrobial agent 30. The dielectric layer 26 contains the dielectric powder 11, the organic binder 4, and the antimicrobial agent 30. Namely, as for the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 14th embodiment shown in drawing 12, the insulating soft magnetic material layer 25 intervenes between the conductive substrate 1 and the dielectric layer 26.

[0045]Drawing 13 is a sectional view showing the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 15th embodiment. As for the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 15th embodiment shown in https://drawing.13, the dielectric layer 26 intervenes between the conductive substrate 1 and the insulating soft magnetic material layer 25.

[0046] <u>Drawing 14</u> is a figure showing the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 16th embodiment of this invention. As shown in <u>drawing 14</u>, the electromagnetic-compatibility repressor 100 by a 16th embodiment has the conductive substrate (or conductive soft magnetism base material which has soft

magnetism) 1, and the insulating soft magnetic material layer 25 of this conductive substrate 1 provided in the field on the other hand at least. The insulating soft magnetic material layer 25 contains the soft magnetic material powder 3, the dielectric powder 11, the organic binder 4, and the antimicrobial agent 30 which present flat state or the shape of a needle.

[0047]In each above-mentioned embodiment, it can be used as the conductive substrate 1, being able to choose - ** of a conductive material plate, a mesh shape conductive material plate, or the textiles of a conductive fiber. It can be used as a conductive soft magnetism base material, being able to choose one of the textiles of a soft magnetism metal plate, mesh shape soft magnetism metal temporary, or a soft magnetism metal fiber.

[0048]As a concrete example of the conductive substrate 1, what is called a punching metal that performed the detailed perforating process to metallic thin plates, such as **, a copper thin plate, stainless steel sheet metal, and aluminum sheet metal, and them, or thin. — the conductor of what is called an extract band metal that carried out the stretching process, or thin line state, after giving a detailed break temporarily. It is the wire gauze etc, which were processed into mesh shape.

[0049]What is necessary is just to replace with a permalloy or iron-silicon steel etc. in which only construction material presents soft magnetism with the same gestalt as a concrete example of the conductive soft magnetism base material 1. In this case, the high electromagnetic-compatibility depressor effect in comparatively low frequency is expectable. Anyway, choosing according to a use is desirable.

[0050]It can do [mentioning an iron aluminum silicon alloy with big high frequency amplitude permeability (Sendust), and an iron nickel alloy (permalloy) as the typical raw material as the soft magnetic material powder 3, or]. Detailed disintegration of the soft magnetic material powder 3 is carried out, and a surface portion is used for it, oxidizing. The aspect ratio of the soft magnetic material powder B is desirable in a thing large (5:1 or more [About]) enough.

[0051]As the organic binder 4. Thermoplastics, such as **, polyester system resin, polyvinyl chloride system resin, polyvinyl butyral resin, polyurethane resin, cellulose type resin, nitril butadiene series rubber, and styrene butadiene series rubber, or those copolymers, an epoxy resin, phenol resin, Thermosetting resin, such as amide system resin and imide system resin, etc. can be mentioned.

[0052]Metal, a magnetic metal, conductive carbon, an organic conductor, etc. to one side or both sides, such as a polyimide substrate, as the insulating base material 5 with vacuum deposition, such as a sputtering technique, the true ****** method, and a chemical-vacuum-deposition (CVD) method. It can use as a conductive substrate which also uses for this invention the conductive base material or the conductive magnetic substrate which formed membranes.

[0053]The end of fine metallic powder, such as silver dust and copper powder, or conductive carbon black, conductive titanium oxide, etc. with the organic binder 4. To one side or both sides of the insulating base material 5, such as a polyimide substrate, without [the thing which kneaded and distributed and sheet–ized this, or] forming a direct sheet by the doctor blade method, the gravure coating method, the reverse coat method, or other means. What formed membranes can be used as the conductive substrate (or conductive soft magnetism base material) 1.

[0054]As the dielectric powder 11 used for the dielectric layer 10 which is another component of this invention described by a 6th embodiment, or the insulating soft magnetic material layer 2, what has the frequency characteristic of large **** and a dielectric constant whose dielectric constant in a high frequency region is comparatively flat is preferred. As an example, barium titanate series ceramics, titanic acid zirconic acid system ceramics, CHI evening N acid zirconic acid system ceramics, lead perovskite system ceramics, etc. can be mentioned.

[0055]Although the silver system inorganic antimicrobial agent which used phosphoric acid zirconium, SEORAITO, hydroxyapatite, a silica alumina, silica gel, etc. as the simple substance can be used as the antimicrobial agent 30, an organic system antimicrobial agent can also be used [an inorganic antimicrobial agent or if needed] for Cu system or a Zn system.

[0056]Next, it verifies below about measurement of the depressor effect by the electromagnetic-compatibility repressor 100.

[0057] In verifying the effect of the electromagnetic-compatibility repressor 100 by an embodiment of the invention, the evaluation system of the following depressor effect was prepared.

[0058] Drawing 15 and drawing 16 are the characterization systems of the electromagnetic-compatibility repressor 100 for verifying the effect of the electromagnetic-compatibility repressor 100 by an embodiment of the invention. Drawing 8 is an evaluation system for measuring a penetration level [dB], and drawing 15 is an evaluation system for measuring a point level [dB]. Each case uses the minute loop antenna 31 for electromagnetic-field transmission with a loop diameter of 2 mm or less, and the minute loop antenna 32 for electromagnetic-field reception for the oscillator 28 for electromagnetic-field wave sources, and the electromagnetic-field intensity measurement machine (element for reception) 29. The spectrum analyzer (not shown) was used for measurement of a penetration level or a joint level.

[0059]The [1st sample] Using the stainless steel network of 24 meshes as the conductive substrate 1, so that the overall thickness size after desiccation and hardening may be 1.2 mm to both sides of this conductive substrate 1. The soft magnetic material paste which is shown in the following table 1 and which consists of combination of the 1st presentation with a doctor blade method. Coating was carried out, curing was performed in 85 degreeC for 24 hours, and the 1st sample that makes ultraviolet curing type resin contain, applied and carried out UV irradiation of the antimicrobial agent content microcapsule to the surface, and made it dry it further was obtained. When the 1st obtained sample was analyzed using the oscillatory type magnetometer and the scanning electron microscope, the easy axis and the magnetic particle orientation direction were sample face inboard.

[0060]

[Table 1]

< 第1の組成>

9 0 重量部
8 重量部
2重量部
40重量部

[0061]The [2nd sample] The 2nd sample as well as the 1st sample was obtained except having used the permalloy (52 nickel-Fe) of 24 meshes which has soft magnetism instead of using the stainless steel network of the 1st sample as the conductive substrate 1 which has the composition of drawing 1.

[0062]The [3rd sample] The 3rd sample as well as the sample 1 was obtained except having used for both sides of a 75-micrometer polyimide film what carried out weld slag membrane formation of the 3-micrometer-thick aluminum as the conductive substrate 1 which has the composition of drawing 2.

[0063]The [4th sample] The 4th sample as well as the 1st sample was obtained except having used what formed the silver paste of the presentation of the following table 2 to both sides of a 75-micrometer polyimide film depending on the method of a doctor blade so that the thickness after desiccation and hardening might be set to 6 micrometers as the conductive substrate 1 which has the composition of drawing 2.

[0064]

[Table 2]

<第2の組成>

銀粉末 平均粒径:3μm	95重量部
有機結合剤 ポリビニルブチラール樹脂	4重量部
硬化剤 (イソシアネート化合物)	1重量部
溶剤 (エチルセルソルブ)	35重量部

[0065]The [5th sample] Using the stainless steel network of 25 meshes as a conductive substrate, coating

of the soft magnetic material paste which consists of the 3rd presentation shown in Table 3 below was carried out with the doctor blade method, and curing was performed at 85 *** for 24 hours so that the overall thickness after desiccation and hardening might be 1.0 mm to these both sides. Then, the dielectric paste which consists of the 4th presentation shown in the following table 4 on the obtained soft magnetic material layer so that the thickness after desiccation and hardening may be set to 100 micrometers per one side, Coating was carried out with the doctor blade method, curing was performed in 85 degreeC for 24 hours, further, the surface was made to contain an antimicrobial agent content microcapsule in ultraviolet curing type resin, and the 5th sample that applied and carried out UV irradiation to the surface, and it was made to harden was obtained.

[0066]When the 5th obtained sample was ****(ed) using the oscillatory type magnetometer and the scanning electron microscope, the easy axis and the magnetic particle orientation direction were sample face inboard.

[0067]

[Table 3]

<第3の組成>

偏平状軟磁性体微粉末	90重量部
組 成:Fe-Al-Si合金	
平均粒径: 1 0 µm	
アスペクト比;>5	
有機結合剂	
ポリウレタン樹脂	8重量部
硬化剤(イソシアネート化合物)	2重量部
溶剤 (シクロヘキサノンとトルエンとの混合物)	40重量部

[0068]

[Table 4]

<第4の組成>

チタン酸パリウム粉末 平均粒経: 7 μ m	90重量部
有機站合剤 ポリウレタン樹脂	8重量部
硬化剤(イソシアネート化合物)	2 重量部
溶剤 (シクロヘキサノンとI・ルエンとの混合物)	45重量部

[0069]The [6th sample] Using the stainless steel network of 24 meshes as the conductive substrate 1, so that the overall thickness after desiccation and hardening may be 1.2 mm to these both sides. The dielectric powder content soft magnetic material paste which consists of the 5th presentation shown in the following table 5 with a doctor blade method. After carrying out coating and performing curing at 85 ** for 24 hours, ultraviolet curing type resin was made to contain an antimicrobial agent content microcapsule, and the 6th sample that applied and carried out UV irradiation to the surface, and it was made to harden was obtained. [0070]

[Table 5]

<第5の組成>

偏平状軟磁性体微粉末	70重量部
組 成:Fe-Al-Si合金	
平均粒径:10 μm	
アスペクト比: > 5	
チタン酸パリウム粉末	20重量部
平均粒径: 7μm	
有機結合剤	
ポリウレタン樹脂	8 重量部
硬化剤(イソシアネート化合物)	2 重量部
溶剤(シクロヘキサノンとトルエンとの混合物)	45重量部

[0071][1st comparison sample] Make ultraviolet curing type resin contain an antimicrobial agent content microcapsule on the 100-micrometer-thick surface of a copper plate, apply to it, and it was made to harden, and was considered as the 1st comparison sample.

[0072]The [7th sample] As the conductive substrate 1, using a 35-micrometer-thick copper plate, so that overall thickness may be 1 mm to these both sides. Coating of the soft magnetic material paste which consists of combination of a presentation of the above 1st was carried out with the doctor blade method, curing was performed at 85 ** for 24 hours, and the 7th sample that make ultraviolet curing type resin contain an antimicrobial agent content microcapsule, and applied and carried out UV irradiation to the surface, and it was made to harden was obtained further. When the 7th obtained sample was analyzed using the oscillatory type magnetometer and the scanning electron microscope, the easy axis and the magnetic particle orientation direction were the directions of a sample face.

[0073]The [8th sample] Except having used the stainless steel network of 120 meshes as the conductive substrate 1 instead of using the stainless steel network of 24 meshes of the 1st sample, it was made the same as the 1st sample, and the 8th sample whose overall thickness is 1 mm was obtained.

[0074][2nd comparison sample] Have approximately spherical shape, scour iron powder 80 weight section whose mean particle diameter is 30 micrometers to nitrile rubber 20 weight section, form a 1.2-mm-thick sheet shaped, make ultraviolet curing type resin contain an antimicrobial agent content microcapsule, apply to the surface, and UV irradiation is carried out. It was made to harden and was considered as the 2nd comparison sample.

[0075] The result of having measured the 1st thru/or 8th sample, 1st, and 2nd penetration levels and joint levels of the comparison sample in the evaluation system shown in drawing 15 and drawing 16 is shown in drawing 17 and drawing 18, drawing 19, and drawing 20, respectively. Drawing 17 and drawing 18 show the frequency characteristic of the electromagnetic-compatibility depressor effect of the 1st and 2nd comparison samples, and drawing 17 is the frequency f [GHz] characteristic of a penetration level [dB]. Here, the standard of the penetration level was made into the electromagnetic-field intensity in the state where there is no electromagnetic-compatibility repressor 100. Drawing 18 is the frequency f [GHz] characteristic of a joint level [dB]. Here, the standard of the joint level was made into the electromagnetic-field intensity in the state where there is no electromagnetic-compatibility repressor 100. [0076]Drawing 19 and drawing 20 show the frequency characteristic of the 1st thru/or the electromagnetic-compatibility depressor effect of the 8th sample, and drawing 19 is the frequency f [GHz] characteristic of a penetration level [dB]. Here, the standard of the penetration level was made into the electromagnetic-field intensity in the state where there is no electromagnetic-compatibility repressor 100. [0077] Drawing 20 is the frequency f [GHz] characteristic of a joint level [dB]. Here, the standard of the joint level was made into the electromagnetic-field intensity in the state where there is no electromagnetic-compatibility repressor 100.

[0078]The 1st thru/or 8th sample, 1st, and 2nd penetration levels and joint levels in the frequency of 800 MHz of the comparison sample were shown in drawing 21, respectively.

[0079]In the case of a conductor (copper foil board) (1st comparison sample), as <u>drawing 17</u> and <u>drawing 18</u> also show, although a penetration level falls substantially, a joint level increases and it is a problem.

[0080]Although the thing which made rubber distribute the spherical iron powder of shape anisotropy which is not almost by the soft magnetism of the 2nd comparison sample on the other hand shows the tendency for a joint level to fall, there is almost no penetration attenuation and the effect of interference control is very thin. [0081]While the penetration level is low enough to the result of the electromagnetic-compatibility repressor of these former in the electromagnetic-compatibility repressor 100 (1st [the] thru/or the 8th sample) of this invention so that clearly also from <u>drawing 19</u>, <u>drawing 20</u>, and <u>drawing 21</u>, a joint level does not increase, either.

[0082]Therefore, in the electronic equipment etc. which exist so that two wiring boards which mount two or more electronic parts may be piled up for example, it becomes possible to control the electromagnetic compatibility of the two same wiring boards by inserting the electromagnetic-compatibility repressor 100 between each wiring boards.

[0083]The electromagnetic-compatibility repressor 100 can secure penetration attenuation greatly, without carrying out the increase of the reflection of spurious radiation, and it becomes possible to deter the electromagnetic compatibility within high frequency electronic equipment including mobile communications equipment.

[0084]The electromagnetic-compatibility repressor 100 shown by the above-mentioned embodiment can give flexibility easily so that the component may show, and the correspondence to complicated shape and the correspondence to severe vibration resistance and a shock demand are possible for it.

[0085]In order that the effect of the electromagnetic-compatibility repressor to this electronic device might verify, the characterization system shown in drawing 15 and drawing 16 was used like the above.

[0086]The [9th sample] The electromagnetic-compatibility repressor 100 is the same composition as the electromagnetic-compatibility repressor 100 shown in drawing_1, and as the conductive substrate 1. Using the stainless steel network of 120 meshes, so that the overall thickness size after desiccation and hardening may be 0.5 mm to both sides of this conductive substrate 1. Coating of the soft magnetic material paste which is shown in the above-mentioned table 1 and which contained the antimicrobial agent in combination of the 1st presentation was carried out with the doctor blade method, curing was performed at 85 ** for 24 hours, and the 9th sample was obtained. When the obtained sample was analyzed using the oscillatory type magnetometer and the scanning electron microscope, the easy axis and the magnetic particle orientation direction were sample face inboard.

[0087]The [10th sample] The 10th sample as well as the 9th sample was obtained except having used for both sides of a 75-micrometer polyimide film what carried out weld slag membrane formation of the 3-micrometer-thick aluminum as the conductive substrate 1.

[0088]The [11th sample] The 11th sample as well as the 9th sample was obtained except having used what formed the silver paste of the presentation of the above 2nd to both sides of a 75-micrometer polyimide film with the doctor blade method so that the thickness after desiccation and hardening might be set to 6 micrometers as the conductive substrate 1.

[0089]As a comparison sample, as described above, it has the 3rd comparison sample that consists of a 100-micrometer—thick copper plate, and approximately spherical shape, iron powder 80 weight section whose mean particle diameter is 30 micrometers was scoured to nitrile rubber 20 weight section, and the 4th comparison sample formed in the 1.2-mm-thick sheet shaped was used.

[0090]The result which showed <u>drawing 15</u> and <u>drawing 16</u> the 9th thru/or 11th sample, 3rd, and 4th penetration levels and joint levels of the comparison sample, and was measured in the evaluation system is shown in drawing 23, drawing 23, drawing 24, and drawing 25, respectively.

[0091] Drawing 22 and drawing 23 show the frequency characteristic of the electromagnetic-compatibility depressor effect of the 1st and 2nd comparison samples. Drawing 22 is the frequency f [GHz] characteristic of a penetration level [dB]. Here, the standard of the penetration level was made into the electromagnetic-field intensity in the state where there is no electromagnetic-compatibility repressor 100. Drawing 23 is the frequency f [GHz] characteristic of a joint level [dB]. Here, the standard of the joint level was made into the electromagnetic-field intensity in the state where there is no electromagnetic-compatibility repressor 100.

[0092]Drawing 24 and drawing 25 show the frequency characteristic of the 9th thru/or the electromagnetic-compatibility depressor effect of the 11th sample, and drawing 17 is the frequency f [GHz] characteristic of a penetration level [dB]. Here, the standard of the penetration level was made into the electromagnetic-field intensity in the state where there is no electromagnetic-compatibility repressor 100. Drawing 25 is the frequency f [GHz] characteristic of a joint level [dB]. Here, the standard of the joint level was made into the electromagnetic-field intensity in the state where there is no electromagnetic-compatibility repressor 100.

[0093]In the case of a conductor (copper foil board) (3rd comparison sample), as <u>drawing 22</u> and <u>drawing 23</u> also show, although a penetration level falls substantially (-50 dB or less), a joint level increases (+7 dB) and it is a problem.

[0094]On the other hand, at the thing which made rubber distribute the spherical iron powder of shape anisotropy which is not almost by the soft magnetism of the 4th comparison sample, although the tendency for a joint level to fall (-0 dB) is shown, there is almost no penetration attenuation (a penetration level. about-1 dB), and there is almost no effect of interference control.

[0095]In the electromagnetic-compatibility repressor 100 (9th [the] thru/or the 11th sample) of this invention to the result of the electromagnetic-compatibility repressor of the 3rd and 4th comparison samples, From <u>drawing 24</u> and <u>drawing 25</u>, while the penetration level is low (-39 dB or less) enough so that clearly, a joint level does not increase, either (+1 dB or less).

[0096]This becomes possible [controlling electromagnetic compatibility effectively], for example, without being influenced by reflection by spurious radiation by arranging an electromagnetic—compatibility repressor between the undersurface of electronic parts, and a printed—circuit board in the electronic equipment etc. which mount electronic parts in a printed—circuit board etc.

[0097]Therefore, the electromagnetic-compatibility repressor 100 becomes controllable [control of mutual interference], without increasing reflection of unnecessary electromagnetic waves. Since the electromagnetic-compatibility repressor 100 is sheet metal, if a noise is considered as the whole electronic device including the parts of the control ***** sake, it will be small and lighter-weight than before, and a cheap electronic device will be obtained, the correspondence to shape that the electromagnetic-compatibility repressor 100 can give flexibility easily so that the component may show, and complicated -- ** is carried out and the correspondence to vibration resistance or a shock demand is possible.

[0098]Next, the electromagnetic-compatibility depressor effect to the hybrid integrated circuit element supposing the case where the circumference of mounting components, such as an active device and a passive component, is covered for the electromagnetic-compatibility repressor 100 of this invention is

explained.

[0099]The [12th sample] It was acquired by making the 7th presentation that shows the 1st insulating soft magnetic material layer and 2nd insulating soft magnetic material layer that have showing—in following table 6 the 6th presentation in the following table 7 adhere to the both sides of the conductive substrate 1 after said slurry immersion.

[0100]

[Table 6]

<第6の組成>

偏平状軟磁性体微粉末	9 0	重量部
組 成:Fe-Al-Si合金		
平均粒径: 10 µ m		
アスペクト比:>5		
有機結合剤		
ポリウレタン樹脂	8	重量部
硬化剤(イソシアネート化合物)	2	重量部
抗菌剤		
銀系無機抗菌剤	0.	5重量部
溶剤(シクロヘキサノンとトルエンとの混合物)	4 0	重量部
エチルセルソルブ	6 5	重量部

[0101]

[Table 7]

<第7の組成>

導電性支持体 鍛纂粉末 平均粒径:3μm	90重量部
有機結合剤 ポリビニルプチラール樹脂	4重量部
硬化剤(イソシアネート化合物)	1重量部
溶剤(エチルセルソルプ)	75重量部

[0102][5th comparison sample] Both sides of the 75-micrometer-thick polyimide film were coated with the silver paste of the same presentation as the conductive substrate 1 by the slurry impregnating method again, it dried and hardened, and the 5th 100-micrometer-thick comparison sample was obtained.

[0103]To these 12th sample and the 5th comparison sample, as described above, It measured on the basis of the electromagnetic-field intensity in the state where a sample does not exist using the characterization system (test equipment shown in <u>drawing 15</u> and <u>drawing 16</u>) of the electromagnetic-compatibility repressor 100 supposing the electromagnetic environment which covered the circumference of mounting components, such as an active device and a passive component.

[0104]The result (frequency characteristic) of penetration level measurement and joint level measurement is shown in <u>drawing 26</u> and <u>drawing 27</u>, respectively. Like [it is ****** from <u>drawing 26</u> and <u>drawing 27</u>, and], by the 5th comparison sample, although a sharp fall is seen about a penetration level, it increases about a joint level. On the other hand, by the 12th sample, a penetration level falls substantially and, moreover, increase of a joint level is not seen, either. While the hybrid integrated circuit element of this embodiment fully has a shielding effect over electromagnetic waves from this like the element which coated the conventional silver pace, it turns out that reflection of electromagnetic waves which were looked at by the conventional element is not seen.

[0105]

[Effect of the Invention] As explained above, according to this invention, the electromagnetic-compatibility repressor which equipped electromagnetic-compatibility depressor effect with antibacterial properties further can be obtained.

[Brief Description of the Drawings]

<u>[Drawing 1]</u> the electromagnetic-compatibility repressor by a 1st embodiment of this invention is shown it is a sectional view in part.

[Drawing 2]the common composition of the conductive substrate in the electromagnetic-compatibility repressor by 2nd and 3rd embodiments of this invention is shown — it is a sectional view in part.

Drawing 3] the conductive substrate in the electromagnetic-compatibility repressor by a 4th embodiment of this invention is shown — it is a sectional view in part.

<u>Drawing 4</u> the conductive substrate in the electromagnetic-compatibility repressor by a 5th embodiment of this invention is shown — it is a sectional view in part.

<u>[Drawing 5]</u> the electromagnetic-compatibility repressor by a 6th embodiment of this invention is shown—it is a sectional view in part.

[Drawing 6] the electromagnetic-compatibility repressor by a 7th embodiment of this invention is shown — it is a sectional view in part.

Drawing 7] drawing 7 shows the electromagnetic-compatibility repressor by an 8th embodiment of this invention — it is a sectional view in part.

Drawing 81the electromagnetic-compatibility repressor by a 9th embodiment of this invention is shown it is a sectional view in part.

<u>[Drawing 9]</u>the common composition of the conductive substrate in the electromagnetic-compatibility repressor by 10th and 11th embodiments of this invention is shown — it is a sectional view in part.

[Drawing 10] the conductive substrate in the electromagnetic-compatibility repressor by a 12th embodiment

of this invention is shown - it is a sectional view in part.

[Drawing 11] the conductive substrate in the electromagnetic-compatibility repressor by a 13th embodiment of this invention is shown — it is a sectional view in part.

[Drawing 12]the electromagnetic-compatibility repressor by a 14th embodiment of this invention is shown — it is a sectional view in part

[<u>Drawing 13]</u>the electromagnetic-compatibility repressor by a 15th embodiment of this invention is shown — it is a sectional view in part.

<u>[Drawing 14]drawing 7</u> shows the electromagnetic-compatibility repressor by a 16th embodiment of this invention — it is a sectional view in part.

[<u>Drawing 15]</u>It is a characterization system of the electromagnetic-compatibility repressor for verifying the effect of the electromagnetic-compatibility repressor by an embodiment of the invention.

[Drawing 16] It is a characterization system of the electromagnetic-compatibility repressor for verifying the effect of the electromagnetic-compatibility repressor by an embodiment of the invention.

<u>Drawing 17]</u>It is the frequency f [GHz] characteristic of the penetration level [dB] of the frequency characteristics of the electromagnetic-compatibility depressor effect of the 1st and 2nd comparison samples.

[Drawing 18]It is a figure showing the frequency f [GHz] characteristic of the joint level [dB] of the frequency f [GHz] characteristics of the penetration level [dB] of the frequency characteristics of the electromagnetic—compatibility decressor effect of the 1st and 2nd comparison samples.

[Drawing 19]It is a figure showing the frequency f [GHz] characteristic of a penetration level [dB] among the frequency characteristics of the 1st thru/or the electromagnetic-compatibility depressor effect of the 8th sample.

[Drawing 20]It is a figure showing the frequency f [GHz] characteristic of a joint level [dB] among the frequency characteristics of the 1st thru/or the electromagnetic-compatibility depressor effect of the 8th sample.

<u>[Drawing 21]</u> It is a figure showing the 1st thru/or 8th sample, 1st, and 2nd penetration levels and joint levels in the frequency of 800 MHz of a comparison sample, respectively.

<u>Drawing 22</u>It is a figure showing the frequency f [GHz] characteristic of a penetration level [dB] among the frequency characteristics of the electromagnetic-compatibility depressor effect of the 1st and 2nd comparison samples.

<u>Drawing 23</u>It is a figure showing the frequency f [GHz] characteristic of a joint level [dB] among the frequency characteristics of the electromagnetic-compatibility depressor effect of the 1st and 2nd comparison samples.

<u>Drawing 24</u>]It is a figure showing the frequency f [GHz] characteristic of the penetration level [dB] of the frequency characteristics of the 9th thru/or the electromagnetic-compatibility depressor effect of the 11th sample.

[Drawing 25]It is a figure showing the frequency f [GHz] characteristic of a joint level [dB] among the frequency characteristics of the 9th thru/or the electromagnetic-compatibility depressor effect of the 11th sample.

[Drawing 26]It is the frequency f [GHz] characteristic of the penetration level [dB] of the frequency

characteristics of the electromagnetic-compatibility depressor effect of the 12th sample and the 5th comparison sample.

[Drawing 27]It is a figure showing the frequency f [GHz] characteristic of a joint level [dB] among the frequency characteristics of the electromagnetic-compatibility depressor effect of the 12th sample and the 5th comparison sample.

[Description of Notations]

- 1 Conductive substrate
- 2 Insulating soft magnetic material laver
- 3 Soft magnetic material powder
- 4 Organic binder
- 5 Insulating base material
- 6 Conductive thin film
- 7 Soft magnetism metal thin film
- 8 Conductive powder
- 9 Conductor layer
- 10 Dielectric layer
- 11 Dielectric powder
- 20 An antibacterial layer
- 21 Microcapsule
- 22 Synthetic resin
- 28 The oscillator for electromagnetic-field wave sources
- 29 Electromagnetic-field intensity measurement machine (element for reception)
- 30 Antimicrobial agent
- 31 The minute loop antenna for electromagnetic-field transmission
- 32 The minute loop antenna for electromagnetic-field reception
- 100 Electromagnetic-compatibility repressor

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-307287 (P2000-307287A)

(43)公開日 平成12年11月2日(2000.11.2)

(51) Int.Cl.7		徽別記号	F I	テーマコード(参考)
H05K	9/00		H05K 9/00	M 5E041
H01F	1/37		H 0 1 F 27/33	5 E 0 5 8
	27/33		1/37	5 E 3 2 1

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 15 頁)

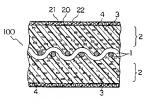
(21)出願番号	特順平11-114876	(71)出願人	000134257
			株式会社トーキン
(22)出願日	平成11年4月22日(1999.4.22)		宮城県仙台市太白区郡山6丁目7番1号
		(72) 発明者	栗倉 由夫
			宫城県仙台市太白区都山六丁目7番1号
			株式会社トーキン内
		(72)発明者	▲吉▼田 栄▲吉▼
			宫城県仙台市太白区都山六丁目7番1号
			株式会社トーキン内
		(74)代理人	100071272
			弁理士 後藤 洋介 (外2名)
			暴放百と結

(54) 【発明の名称】 電磁干渉抑制体

(57) 【要約】

【課題】 抗菌性を付与された電磁干渉抑制体を提供す ることにある。

【解決手段】 電磁波ノイズを抑止する電磁干渉抑制体 において、軟磁性粉末3と有機結合剤4とを含む複合磁 性体に、抗菌剤を含むマイクロカプセル12を含有した 樹脂21を塗布して抗菌層20を形成して抗菌性を付与 した。また、複合磁性体中に抗菌剤を含有させることも できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 軟磁性粉末と有機結合剤とを含む複合磁性体を用い、電磁波ノイズを抑止する電磁干渉抑制体に おいて, 前記複合磁性体に抗菌性を付与したことを特徴 レオる電解干渉抑制体。

【請求項2】 請求項1記載の電磁干渉抑制体において、前記抗菌性は、前記複合磁性体の表面に形成された 抗菌層によって呈され、前記抗菌層は抗菌剤を含むマイ クロカプセルを合成樹脂にて固定したものから実質的に なることを特徴とする電磁干渉抑制体。

【請求項3】 請求項1記載の電磁干渉抑制体において、前記抗菌性は、前記接合磁性体へ内部に含有された 抗菌剤によって呈されることを特徴とする電磁干渉抑制 体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高周波領域において不要電磁波の干渉によって生じる電磁障害を抑制する ために用いられる電磁干渉抑制体に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、デジタル電子機器をはじめ高周数 を利用する電子機器類が普及しており、中でも準マイク 口波階域を使用する通信機器部の普及がめごましい。例 えば、携帯電話に代表される移動体通信機器は、特に小 型化・軽量化の要求が順着であり、高密度実装化が最大 の課題となっている。

[0003] したかって、過密に実装された電子部品類 やプリント配線には、信号処理速度の高速化も図られて いるため、静電及び電盤結合によめ網組結合の増大化や 放射ノイズによる干渉などが生じ、電子機器類の正常な 30 動作を妨げる事態が少なからず生じている。このような 電子機器への悪影響は、いわゆる電磁波障害と呼ばれ る。

[0004] 従来、電磁放御等に対し、回路にローパス フィルタを挿入したり、問題となる回路を遠ざけたり、 或いはシールディングを行うなどの手段を選じて電磁波 障害の原因となる電磁結合、不要輻射イイズを抑制して いる。また、能動素子自身を樹脂で封止した後に、導電 ベーストなどでシールドして不要輻射に対して能動素子 を遮蔽するという方策が考えられている。しかしなが ら、従来の電磁波障害に対する対策は種々の欠点を備え ており、必ずしも実用的ではなかった。

【0005】この欠点を解決するものとして、特用平7 -212079号公報(※米技術1と呼ぶ)に開示され た複合磁性体及び電磁干渉助制体がある。この電磁干渉 抑制体は、軟磁性粉末と有機的合剤とを含む複合磁性体 からなり、電磁波の透極に対しては、増電性のシールド 材と同等の遮蔽効果をもち、電磁波の反射に対しては、 少なくとも反射による電磁約合を助長させることがな く、また、フィルタ等を用いる代わじた、電子装置その 50

ものを改良して、容易に配線基板から外部へ放射するノ イズや配線基板内部での部品間の相互下沙や信号線間の 電磁誘導はよる影響作を抑制することができるという利 点を有している。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前述した電 磁干渉抑制体を構成する複合磁性体に含有される有機結 合剤の選択によっては、細菌又はカビ等によって劣化や 変色し、電磁干渉抑制体の機能を損ね、寿命を短くする というような欠占がある。

【0007】また、電磁干渉抑制体を使用する用途において、衛生性が必要とされるものがある。

【0008】後って、抗菌性を付与した電緒干渉抑制体 によって、携帯移動電話等や電話器等、その他、スイッ キやリモートコントロール部温等の人の手上接触する部 位に用いる電子機器や衛生性が必要とされる部位に使用 することによって、電子機器そのものの寿命を延ばし、 使用部位の拡大を図り、電磁干渉抑制体の需要を増大す ることができる。

【0009】それゆえに、本発明の技術的課題は、抗菌 性を付与された電磁干渉抑制体を提供することにある。 【0010】

【課題を解決するための手段】 本発明によれば、軟磁性 粉末と有機結合剤とを含む複合銀性体を用い、電磁波ノ イズを抑止する電磁干渉抑制体において、前記複合磁性 体に抗菌性を付与したことを特徴とする電磁干渉抑制体 が得られる。

[0011] また、本発明によれば、前記電磁干渉抑制 体において、前記抗菌性は、前記複合磁性体の表面に形 成された抗菌層によって呈され、前記抗菌層は抗菌剤を 含むマイクロカブセルを合成樹脂にて固定したものから 実質的になることを特徴とする電磁干渉抑制体が得られ る。

【0012】また、本発明によれば、前記電磁干渉抑制 体において、前記五旗管はは、前記複合磁性体の内部に含 有された抗菌剤によって呈されることを特徴とする電磁 干渉抑制権が得られる。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。

【0014】関 は本発卵の第1の実施の形態による電 軽干砂抑削体を示す前面図である。図 1を参照すると、 本発卵の第1の実施の形態による電磁干砂抑制化100 は、導電性支持体(もしくは軟健性を有する導電性軟磁 性支持体)1と、この導電性支持体1の少なくとも一方 面(図 1では両面)に設けられている絶縁性軟磁性体層 ととを有する点では、能果技術と同様である。

【0015】本発明の実施の形態による電磁干渉抑制体 100は、更に、表面に抗菌剤を含むマイクロカプセル 21を含有する合成機能22を塗布又は印刷形成した抗 菌層 2 0 を有する点で、従来技術によるものとは異な

[0016] この電磁干渉抑制体100において、絶縁 性軟磁性体層2は扁平状または針状のうちの一方の形状 を呈する軟磁性体粉末3と、軟磁性体粉末3が均一に分 散されている右機結合約4とを含む。

【0017】また、電磁干渉制制体100において、導電性生資格1を構成要素とする場合には、例えば、導電性生殖体1を構成を制計が帯電体板、もしくは帯電性機構を認識物のうちの一つを選択して用いる。また、導電性軟化性支持1と構成を表する場合には、導電性軟板性性が1と軟成性全周板、制目状軟型性全周板、もしくは軟磁性金剛繊維の減物のうちの一つを選択して用いる。

【0018】図2は本発明の第2の実施の形態による電 転干渉期前体を示す前面図である。図2に示すように、 電低干渉期前体100は、導電性支持体(もしくは軟盤 性を有する導電性飯健性支持体)1が、絶縁基材5をこ の総縁基材5の少なくも一方の面に蒸音機関された導 電性薄房6とを含む。図2では、絶縁基材5の面面に蒸音 着成膜された導電性溶膜6を機として示したが、絶縁基 材5の一方面に到電性溶膜6を凝発が成態してもよい、な お,導電性溶膜6上には、図1に示した絶縁性軟磁性体 個2と阿膝な絶縁性軟磁性体層2が現けられ、その表面 に表す前層820を有している。

【0019】第3集施の形線の電缸干渉申期体100を 図2に基すき設明すると、電磁干渉抑制体100は、専 電性支持体(もしくは軟磁性を有する場電性軟磁性支持 体)1が、絶縁基材5との急縁基材5の少なくとも-方面に蒸着破膜された軟磁性金両薄膜7とを含む。図20 では、絶縁基材5の両面に蒸造成膜24比水磁性金属 膜7を例として示したが、急線基材5の一方面に破燃性 極了を例として示したが、急線基材5の一方面に破燃性 極度7と使した。以下、2018年度21日間を 上では、2018年度21日間で、2018年度21日間を 整線性を放性体間2及び芳香間20を有しているもので ある。

【0020】図3は本発明の第4の実施の死態による電 磁干浄郷制体100を示す前面図である。図3を郷財 ると、本発明の第4の実施の形態による電磁干浄明制体 100は、導電性支持体1が導電性粉末8と有機結合剤 40 4とからなる。この導電性支持体1の少なくとも一方面 には、図1で示した絵縁性軟磁性体層2と同様な絶縁性 軟磁性体圏と枯縮層2の分類分られる。

【0021】図4は本幣門の第5の実施の形態による電 鉱干渉郷制体100を示す断面図である。図4に示すよ うに、導電性支持体1が、総縁基材5とこの総縁基材5 の少なくとも一方の面上に設けられた導電体層9と、そ の上に設けられた抗菌層20を有している。この導電性 支持体1の導電体9と他の面には、図1で示した総縁性 軟磁性体層2と同様な総縁性軟磁性体層が設けられる。 尚, 導電体9上に, 絶縁性軟磁性体層2と同様な絶縁性 軟磁性体層を設けた後, 抗菌層20を絶縁基板面又は絶 縁性軟磁性体層の上に設けても良い。

[0022] 閣ら及び図6は、第6及び第7の実備の形態による電磁干浄抑制体100を大々示す前面図である。図5及び図6に示すように、電磁干抑制制体100は、導電性支持体(もしくは軟磁性を有する導電性軟磁性支持体)1と、導電性支持体1の少なくとも一方面に設けられた絶縁性軟磁性体層2の少なくとも一方面に設けられた絶縁性軟磁性体層2の少なくとも一方面に設けられた影電体層10と、その

上に設けられた抗菌層20を有している。

【0023】総験性軟盤性体層2は偏平状もしくは針状 を呈する敬磁性体粉末3と有機結合剤4とを含む。誘電 板関10は、誘弧体粉末11と有機結合剤4とを含む。 即ち、図5に示す第6の実施の形態による電磁干渉抑制 体100は、導電性支持体1と誘電体関10との間に絶 級性軟磁性体優2が介在されている。

【0024】図6は第7の実施の形態による電電行時期 削体100を示す新面図である。図6に示す第7の実施 の形態による電磁行時即制体100は、導電性支持体1 と絶縁性軟盤性体解2との間に誘電体層10が介在され ている。絶縁性軟盤性体層2の外側には、折風層20が 別けられている。

【0025】図7は、本発門の輩をの実施の形態による 電量干搾抑制体100を示す図である。図7に示すよう に、第8の実施の形態による電量干搾抑削体100は、 専電性支持体(もしくは軟磁性を有する導電性軟磁性を 持体)1と、この専電性支持体10少なくとも一方面れた 損けられた総性を報性体配置とと、その上に設けられた 抗菌層20を有している。絶縁性軟磁性体層2は、偏平 状もしくは針状を損する軟磁性体粉末3、誘電体粉末1 、及び有機約分割を含なた。

【0026】上記名実施の形態において、響電性支持体 1としては、導電体製、網目状導電体製、もしくは導電 性繊維の織物のうちの一つを選択して使用できる。ま た、導電性軟配性支持体としては、軟磁性金属板、網目 状軟磁性金属板、もしくは破磁性金属繊維の織物のうち の一つを響取して使用できる。

【0027】壊電性支持外10具体的な例としては、 薄板、ステンレス薄板、アルミーウム薄板等の企画薄 板、及びそれちに微細な穴間け加工を施した。いわゆる パンチングメタル、或いは薄、仮に微細な切れ目を施し た後に、延伸加工した。いわゆるエキスパンドメタル、 或いは細線状の場体を網目状に加工した金線などであ

【0028】また、導電性軟磁性支持体1の具体的な例 としては、同様の形態にて材質のあが敏磁性を呈するパーマロイ或いは鉄一建素鋼等に代えればよい。この場 の、比較的低い周波数での高い電磁干渉抑制効果を期待 できる、いずれにしても、用途に応じて選択するのが望 ましい。

[0029] 軟態性体粉末3としては、高雨炭透磁率の 大きな鉄アルミ珪素合金(センダスト),鉄ニッケル合 金(パーマロイ)をその代表的素材として料7ることか できる。軟磁性体粉末3は、微制粉末化され表面部分を 酸化して使用される。なお、軟磁性体粉末Bのアスペク ト比は十分に大きい(おおよぞ5:1以上)ことか望ま しい。

【0030】 有機結合剤 4 としては、ボリエステル系樹脂、ボリ塩化ビニル系樹脂、ボリビニルブチラール樹脂、ボリビンフチラール樹脂、ボリウレタン樹脂、セルロース系樹脂、ニトリループタジェン系ゴム、スチレンーブダジェン系ゴム等の熱可塑性樹脂症収 はそれらの共康合体、エボキシ樹脂、フェノール樹脂、アミド系樹脂、イミド系樹脂等の熱硬化性樹脂等を発行ることができる。

【0031】また、総縁結析らとして例えば、ボリイミ 下基材等の片面もしくは両面に金属、磁性金属、導電性 カーボン、有機等電体等をスペッタ法、真空蒸着法、化 学蒸着(CVD)法等の蒸油法により成果した導電性基 材もしくは導電性磁性基材も本発明に用いる導電性支持 なとして用いることができる。

【0032】また銀粉、銅粉等の金属微粉末もしくは導性性カーボンブラック、導電性機化チタン等を有機結合 削4とともに認練、分散しこれをシート化したもの、或 いは直接シート化せずにポリハミド基材等の総縁基材さ の片面もしくは両面にドクターブレード法、グラビアコ ート法或いはリバースコート法等の手段により成既した ものを導電性支持体(もしくは導電性軟磁性支持体) 1 として使用できる。

【0033】さらに、第6の実施の形態で述べた本発明 30もう一つの構成要素である影響体関 10、もしくは絶縁性軟磁性体関 2に用いる誘電体形末11としては、高周波領域での誘電率が大ぎく、かつ誘電率の展波数特性が比較的平単なものが穿ましい。一何として、チタン酸バリウム系セラミック、チタン酸ジルコン酸系セラミック、チン配ジルコン酸系セラミック、チン酸ジルコン酸系セラミック、チャン酸ジルコンカイト系セラミック等を維好ると、たができる。

【0034】また、抗菌関20を機成するマイクロカブ セル21とこれらを含有する台成制部からなる。マイク ロカブセル21は、特別平8-299422号公報に示 ストリン包接化代物からなるか、あるいは、揮散性を有 する抗菌剤のシクロデキストリン危軽化合物とんで Pと からなる。このマイクロカブセルに用いられる抗菌剤と しては、イソチオシアニン酸ブリル、ヒノキチオール、 ヒパオイル、パニーローヤル、レモングラ ス、レモン、スパイクラベンター、サッメグ、オレガ ノ、セージ、ジンジャー、セーボリー、タイム、オール スパイス、シダーヴッド、シナモンバーク、クローブパ ッズ、カコブテ、バイン、ティートリリー、テルペン類 50 などが挙げられる。

【0035】 これらのマイクロカプセル21は、高分子 棚間、例えば、紫外線硬化性樹脂に含有させて、電磁干 沙抑制表面に途布または印刷され、硬化させることによって、抗菌簡20が形成される。

【0036】図8は本発明の第9の実施の形態による電 低干沙抑制体を示す前面図である。図8を参照すると、 本死明の第9吹旋の形態による電磁干沙抑削体100 は、研電性支持体(もしくは放射性を有する研密性軟盤 性支持体)1と、この導電性支持体10少なくとも一方 面(図1では両面)に設けられている絶縁性体磁性体階 25とを有する点では、従来技術と同様である。しか し、本発明の第9の実施の形態による電磁干沙抑削体1 00は、総載軟磁性体階 25と構成している点で、従来技術によるも 軟化機体階 25を構成している点で、従来技術によるも かとは異なる。

【0037】この電銀干渉抑制体100において、絶縁 性軟磁性体層25は、扁平状または針状のうちの一方の 形状を呈する軟磁性体粉末3と、軟磁性体粉末3が均一 に分散されている有機結合剤4と、抗菌剤30とを含

【0038】また、電報干砂却制体100において、導電性支持体1を構成要素とする場合には、例えば、導電性支持体1を帯電体板、網15代等電体板、もしくは導電性組織の議物のうちの一つを選択して用いる。また、導電性軟能性支持体1を軟磁性金層板、網目状軟磁性金層板、をしくは軟磁性金層機能の減物のうちの一つを選択して用いる。

【0039】 関9は本発卵の第10の実施の形態による 磁紙干渉抑制体と示す断面図である。図9に示すよう に、電磁干渉抑制体100は、導電性支持体(もしくは 株配性を有する導電性軟磁性支持体)15, 総縁基材ち とこの絶縁数計ちの少なくとも一方の面に蒸熱視度され た導電性薄膜6とを含む。図9では、絶縁基材ちの両面 に蒸熱波膜された導電性膜膜6を例として示したが、絶 縁基材ちの一方面に導電性薄膜6と蒸筒波度してもよ い。なお、導電性薄膜6上には、図8に示した絶縁性軟 磁性体図25に同様な影線性板壁性体図25が設けら ル・そのまたが随性が低手なすいるものである。

[0040]第11の実施の形態の電低干渉期制体100 を図りに基すき説明すると、電磁干渉抑制体100 は、導電性支持体(もしくは軟無性を有する時電性軟能 性支持体)1が、絶縁基材5とこの絶縁基材5の少なく を一方面に蒸着成膜された軟無性金属薄膜7とを含 公 図9では、絶縁基材5の両面に蒸着波膜された軟磁 性金属薄膜7を倒として示したが、絶縁基材5の一方面 に軟磁性金属薄膜7を蒸着或膜してもよい、なお、軟磁 性金属薄膜7上には、図8に示した絶線性軟健性体層25を有 をと同様を抗菌が30%を対象性体層25を有 をと同様を抗菌が30%を対象性体層25%を有 をと同様を抗菌が30%を対象性性体層25%を有 をと同様な抗菌が30%を対象性性体層25%を有 をと同様な抗菌が30%を対象性性軟層25%を有 しているものである。

【0041】図10は本辞明の第12の実施の形態による電磁干浄抑制体100を示す断面図である。図10を参照すると、本発明の第12の実施の形態による電磁干沙抑制体100は、導電性支持体1が導電性粉末8と有機結合剤4とからなる。この導電性支持体1の少なくとも一方面には、図8で示した絶縁性軟磁性体層25が設けられる。

[0042] 図11は本労利の第13の支援の形態による電磁干停抑制体 100を示す断面固である。図11に 10 元すように、専電性支持体 1が、絶縁基括55とこの絶縁基材5の少なくとも一方の面上に設けられた専電体幣9とを有している。この専電性支持体 12は電低 9の少なくした一方の面には、図8で示した絶縁性軟磁性体層 25と同様な経験性を顕体性無常が設けられる。

【0043】図12及び図13は、第14及び第15の 実施の形態による電配干渉抑制体100を夫々示す断面 図である。図12及び図15に示すように、電配干渉抑 制体100は、導電性支持体(もしくは軟起性を有する 導電性敷健性を持体)1と、調電性支持体10少なくと も一方の面に設けられた絶縁性軟配性体図25と、絶縁 性軟磁性体層25の少なくとも一方の面に設けられた誘 端体図26とを打している。

【0044】総縁性飲経性体間25は、編字状もしくは 針状を呈する軟磁性体粉末3と有機結合剤4と、抗菌剤 30とを含む。誘電体粉26は、誘電体粉末11と有機 結合剤4と抗菌剤30とを含む。即ち、図12に示す第 14の実施の形態による電磁干渉抑制体100は、導電 性支持体1と誘電体層26との間に絶縁性軟磁性体層2 5が介在されている。

【0045】図13は第15の実施の形態による電磁干 沙抑制体100を示す断面図である。図13に示す第1 5の実施の形態による電磁干渉抑制体100は、導電性 支持体1と絶縁性軟磁性体層25との間に誘電体層26 が介在されている。

【0046】図14は、本港明の第16の実施の形態による電磁干渉抑制体100を示す図である。図14に示すように、第16の実施の形態による電磁干渉抑制体100は、導電性支持体(6LCは軟磁性を有する導電性軟磁性支持体)1と、この導電性支持体10少なくとも40一方面に設められた総縁性極磁性体図25とを有している。絶異性軟磁性体図25は、偏平状もしくは針状を呈する軟磁性体粉23。誘電体粉末11,有機結合剤4,及び抗菌剤30を含む。

【0047】上記各実施の形態において、専電性支持体 1としては、専電体板、網目決専電体板、もしくは導電 性繊維の維勢のうちの一つを選択して使用できる。ま た、導電性軟保性支持体としては、軟低性金属板、網目 状軟磁性金属板、もしくは軟磁性金属繊維の総物のうち の一つを選択して使用できる。 [0048] 零電性支持体10具体的な例としては、鋼 薄板、ステンレス薄板、アルミニウム薄板等の金削率 低、及びそれらに微軸な穴側け加工を施した。いわゆる パンチングメタル、或いは薄、仮に微細な切れ目を施し た後に、延申加工した。いわゆるエキスパンドメタル、 或いは細線状の導体を網目状に加工した金網などであ る。

【0049】また、響電性軟磁性支持体1の具体的な例 としては、同様の形態にて材質のあが破壁を至するパー マロイ或い鉄手 土土動物で代えればよい、この場 合、比較的低い周波数での高い電磁干砂抑制効果を期待 できる。いずれにしても、用途に応じて選択するのが望 ましい。

【0050】 軟酸性体粉末3としては、高周波透暖率の 大きな鉄アル。主理素合金(センダスト)、鉄ニッケル合 金(バーマロイ)をその代表的素材として挙げることか できる。軟艇性体粉末3は、微細粉末化され表面部分を 酸化して使用される。なお、軟磁性体粉末Bのアスペク ト比は十分に大きい(おおよそ5:1以上)ことが望ま した。

【0051】有機結合剤4としては、ボリエステル系樹 脂、ボリ塩化ビニル系樹脂、ボリビニルブチラール樹 脂、ボリウレタン樹脂、セルロース系樹脂、ニトリルー ブタジエン系二ム、スチレン一ブタジエン系二ム等の熱 可塑性樹脂或いはそれらの共塩合体、エボキシ樹脂、フ ェノール樹脂、アミド系樹脂、イミド系樹脂等の熟硬化 性樹脂等を挙げることができる。

【0052】また、絶縁基材5として例えば、ポリイミ ド基材等の片面もしくは両面に金属、磁性金属、導電性 ルーボン、有線響電体等をスパッタ法、真空発育法、化 学蒸着(CVD) 法等の洗着法により成膜した導電性基 材もしくは導電性磁性基材も本発明に用いる導電性支持 体として用いるよとができる。

【0053】また無跡、瀬野等の金属微粉末もしくは薄電性カーボンブラック、導電性施化チタン等を有機結合剤4とともに距離、分散してれをシート化したもの、成いは直接シート化せずにポリイミド基材等の線縁基材5の片面もしくは頭面にドクターブレード法、ウラビアコート法或いはリバースコート法等の手段により成膜したものを導電性支持体(もしくは導電性軟盤性支持体)1として使用できる。

【0054】さらに、第6の実織の形態で述べた本発明 のもう一つの構成要素である誘電体图10,もしくは絶 縁性軟態性体图2に用いる誘電体粉末11としては、高 周波顕線での誘電率が大ぎく、かつ誘電率の限波数特性 が比較的平坦なものが好ましい、一例として、子タン酸 パリウム系セラミック、子タン酸ジルコン酸系セラミック ク、チタン酸ジルコン酸系セラミック、鉛ペロブスカイ ト系セラミックを参撃があるとができる。

【0055】また、抗菌剤30としては、リン酸ジルコ

ニウム、セオライト、ヒドロキシアパタイト、シリカア ルミナ、シリカゲル等を単体とした銀系無機抗菌剤を用 いることができるが、その他にC u 系やZ n 系の無機抗 菌剤又は必要に応じて有機系抗菌剤を用いることもでき

【0057】本発明の実施の形態による電磁干渉抑制体 100の効果を検証するにあたっては、以下の抑制効果 の評価系を準備した。

【0058】図15及び図16は木作野の実施の形態による電磁干渉抑制体100の効果を検証するための電磁干渉抑制体100の特性評価系である。図8は、透過レベル [d B] を測定するための評価系であり、図15は、結合レベル [d B] を測定するための評価系である。各々の場合とも、電磁界波楽用発振器28及び電磁界機度測定器(受信用素子)29には、ループ後2mm

以下の電磁界送信用微小ループアンテナ31、電磁界受 信用微小ループアンテナ32を用いている。透過レベル もしくは結合レベルの測定にはスペクトラムアナライザ (図示せず)を使用した。

10

【0059】 (第1の試料】導電性支持体1として24 メッシュのステンレス郷を用、この導電性支持体1の 両面に乾燥、硬化後の全厚寸法が1.2mmとなるよう に下記表1に示す第1の組成の配合からなる影磁性体ベーストをドクターブレード法により竣工し、85°Cに て24時間キュッリングを行い、更に、抗菌剤含有マイ クロカブセルを架外線硬化型側面に合育させでその表面 に塗布し、繋外線照射してを強させた第1の3材を得 た。なお、得ら4元等1の試料を提物型磁力が並びに走 査型電子顕微線を用いて解析したところ、磁化容易軸及 び磁性粒子配向方向は試料相面均方面であった。

[0060]

mm 【表1】 <第1の組成>

偏平状軟磁性体微粉末	9 0 重量部
組 成:Fe-Al-Si合金	
平均粒径: 10 µm	
アスペクト比:>5	
有機結合剤	
ポリウレタン樹脂	8 重量部
硬化剤(イソシアネート化合物)	2 質量部
溶剤(シクロヘキサノンとトルエンとの混合物)	40重量部

【0061】 [第2の試料]図1の構成を有する導電性 支持体1として、第1の試料のステンレス網を用いる代 わりに軟磁性を有する24メッシュのパーマロイ(52 Ni一Fe)を用いた以外は、第1の試料と同様にして 第2の試料を得た。

【0062】 [第3の試料] 図2の構成を有する導電性 45 支持体1として75μmのポリイミドフィルムの両面に 厚さが3μmのアルミニウムをスパッタ成膜したものを 用いた以外は、試料1と同様にして、第3の試料を得た。

[0.063] [第4の試料] 図2の構成を有する導電性 支持体1として75 μ mのポリイミドフィルムの両面に 下記表2の観成の銀ペーストを変態、硬化像の厚さが6 μ mとなるようにドクターブレード方にて破膜したもの を用いた以外は、第1の試料と同様にして第4の試料を 得た。 【0064】 【表2】 11 <第2の組成>

厳粉末
 平均按径: 3 μ m
 台機結合剤
 ボリビニルブチラール機能
 を化剤 (イソシアネート化合物)
 1 重量率
 溶剤 (エチルセルソルプ)
 3 5 重量率

ッシュのステンレス線を用い、この両面に焼焼、硬化後 の全厚が1.0mmとなるように、以下表3に示す第3 の租成からなる軟磁性体ペーストをドクタープレード法 により強工し、85でにて24時間キュアリングを行っ た。その後、得られた軟能性体質上に以下の表4に示す 第4の租成からなる誘電体ペーストを乾燥、硬化後の厚 さが計画当たり100μmとなるように、ドクタープレード法により強工し、85°Cにて24時間十二アリン グを行い、さらに、表面に抗菌剤含有マイクロカプセル 85%)解硬化型樹脂に含有させ、表面に強布し、紫外線 照射して硬化させた第50端料を得た。

【0066】なお、得られた第5の試料を振動型磁力計 並びに注査型電子顕微鏡を用いて解析したところ、磁化 容易軸及び磁性粒子配向方向は試料面内方向であった。 【0067】

【0065】 [第5の試料] 導電性支持体として25メ 【表3】 **<第3の組成>**

編平状軟磁性体験粉末
 組 成: F e − A l − S i 合金
 平均粒径: 10 μm
 アスペクト比; > 5
 有機給合剤
 ポリウレタン樹脂
 級化剤(イソシアネート化合物)
 2 重量部
 溶剤(シクロヘキサノンとトルエンとの混合物)
 4 0 重量部

[0068]

【表4】 <第4の組成>

チタン酸パリウム粉末	90重量部
平均粒径: 7μm	
有機結合剤	
ポリウレタン樹脂	8重量部
硬化剤(イソシアネート化合物)	2重量部
溶剤(シクロヘキサノンとI・ルエンとの混合物)	45重量率

13

化後の全厚が1.2mmとなるように以下の表5に示す 第5の組成からなる誘電体粉末含有軟磁性体ペーストを ドクタープレード法により塗工し、85℃にて24時間 キュアリングを行った後、抗菌剤含有マイクロカプセル 14 を紫外線硬化型樹脂に含有させて、表面に塗布し、紫外 線照射して硬化させた第6の試料を得た。

【0070】 【表5】

ジル 【表5】 <第5の組成>

偏平状軟磁性体衡粉末	70重量者
組 成:Fe-Al-Si合金	
平均粒径: 10 µm	
アスペクト比: >5	
チタン酸パリウム粉末	20重量等
平均粒径:7 µ m	
有機結合剤	
ポリウレタン樹脂	8 重量音
硬化剤 (イソシアネート化合物)	2 重量音
溶剤(シクロヘキサノンとトルエンとの混合物)	4 5 重量音

【0071】 [第1の比較試料] 厚さが100 μ mの鋼 板の表面に杭菌剤含有マイクロカプセルを繁外線硬化型 樹脂に含有させて塗布し、硬化させて第1の比較試料と

【0072】 【第7の試料、導電性支持体1として、厚 30 が35 μ m の調板を用い、この両面に全厚が 1 mmと なるように上記簿 1 の組成の配合からなる敬概性体ペーストをドクタープレード法により竣工し、85 ℃にて2 4 期間キュアリングを行い、さらに、抗電剤含有マイク ロカブセルを繋外縞硬化型網部に合有させて表面に途布 し、繋外線原料して硬化させた第7の減料を得た。な お、得られた第7の減料を援助型は方針がびに走重型電 子類微鏡を用いて解析したところ、緩化容易軸及び磁性 粒子配合方向は減料電方向であった。

【0073】 第8の試料」導電性支持体1として、第 40 1の試料の24メッシュのステンレス網を用いる代わり に120メッシュのステンレン網を用いた以外は、第1 の試料と同じにして全厚が1mmの第8の試料を得た。 【0074】 第2の比較試料] 略球状の形状を有し、 平均粒径が30μmの鉄粉80重鼠部をニトリルゴム2 0重量部に続り込み、厚さ1.2mmのシート状を形成 し、抗菌剤含有マイクロカブセルを繋外隔硬化型機構に 合有させて表面に塗布し、紫外線原射して硬化させて、 第2の比較試料とした。

【0075】第1乃至第8の試料、第1及び第2の比較 50 まい問題である。

試料の透過レベル及び結合レベルを図16及び図16に 示す評価系にで測定した結果を図17及び図18、図1 9及び図20に共々示す。図17及び図18は、第1及 び第2の比較試料の電磁干浄非削効果の測数数計性を示 し、図17は透過レベル「GB」の周波数「「GHz] 特性である。ことで、透過レベルの基準は、電磁干渉抑 制体100がない状態の電磁射強度とした。図18は結 合レベル [dB] の周波数「[GHz]特性である。こ こで、結合レベルの基準は、電磁干渉抑制体100がな い対地の滞保度機能を上した。図18は 10は2000では、電磁干渉抑制体100がな い対地の滞保度機能を上した。

【0076】図19及び図20は、第1乃至第8の試料の電磁干渉抑制効果の開波数特性を示し、図19は透過レベル[dB]の周波数f[GHz]特性である。ここで、透過レベルの基準は、電磁干渉抑制休100がない状態の電磁界強度とした。

【0077】図20は結合レベル「dB」の原液数 f [GHz] 特性である。ここで、結合レベルの基準は、 電磁干渉事制体100がない状態の電磁界強度とした。 【0078】図21には、第1万至第8の試料、第1及 び第2の比較試料の周波数800MHzにおける透過レ ベル及び結合レベルを大を示した。

【0079】図17及び図18からも判るように、導体 (鋼箔板)のみの場合(第1の比較試料)では、透過レ べいは大幅に低下するものの、結合レベルが増大してし まい問題である。

【0080】一方、第2の比較試料の軟磁性で形状異方 性のほとんどない球状鉄粉をゴムに分散させたもので は、結合レベルが低下する傾向を示しているものの、透 過減衰がほとんどなく干渉抑制の効果は極めて薄い。

【0081】これら従来の電磁干渉抑制体の結果に対して、本発明の電磁干渉抑制体100(第1乃至第8の試料)においては、図19、図20、及び図21からも明白なように、透過レベルが十分低くなっているとともに、結合レベルも増大することがない。

【0082】したがって、例えば、複数の電子部品を実 10 装する2つの配線基板が重ね合わされるように存在する 電子機器等において、各々の配線基板間に電盤干渉抑制 体100を挿入することで同一の2つの配線基板の電磁 干渉を抑制することが可能となる。

[0083] 電磁干渉抑制体100は、不要輻射の反射 を増大化させることなく透過減度を大きく無保すること ができ、移動体通信機器をはじめとする高周波電子機器 類内での電磁干渉を抑止することが可能となる。

[0084] なお、上記実施の形線で示した電磁干渉抑 制体100は、その構成要素がらわかるように容易に可 20 機性を付与することが可能であり、複雑な形状への対応 や厳しい電振動、衝撃歩火への対応が可能である。

【0085】この電子装置への電磁干渉抑制体の効果の 検証する為に、上記と同様に、図15及び図16に示し た特性評価系を用いた。

【0086】【第9の試料】電電干渉抑制体100は 図1に示した電磁干渉抑制体100と同じ構成であっ て、郷電性支持体1として120メッシュのステンレス 報を用い、この導電性支持体1の両面に変集。硬化後の 全原寸法が0.5 mmとなるとうに上記表1にす第130 の組成の配合に抗活剤を含有した軟配性体ベーストをド クターフレード法により竣工し、85でにて24時間キ エアリングを行い第9の試料を得た。なお、得られた試 料を振動型磁力計並びに走査型電子顕微鏡を用いて解析 したところ。磁化容易軸及び磁性粒子配向方向は試料面 内方向であった。

【0087】 [第10の試料] 導電性支持体1として7 5μmのポリイミドフィルムの両面に厚さが3μmのア ルミニウムをスパッタ成膜したものを用いた以外は、第 9の試料と同様に1、7覧10の試料を得た。

【0088】 [第11の試料] 導電性支持体1として7 5μmのボリイミドフィルムの両面に上記第2の組成の 銀ベーストを乾燥、硬化後の厚さが6μmとなるように ドクターブレード法にて成膜したものを用いた以外は、 第9の試終と同様にして第11の試料を得た。

【0089】比較試料としては、上記したように、厚さが 100μ mの解板からなる第3の比較試料と、略球状の形状を有し、平均粒径が 30μ mの鉄粉80重量部をエトリルゴム<math>20重量部に練り込み、厚さ<math>1.2mmのシート状に形成した第4の比較試料を用いた。

【0090】第9乃至第11の試料,第3及び第4の比較試料の透過レベル及び結合レベルを図15及び図16 に示し評価系にて測定した結果を図22,図23、図2 4及び図25に夫々示す。

【0091】 B22及び図23は、第1及び第2の比較 試料の電磁干渉抑制効果の開波数特性を示している。図2は透過レベル[dB]の関波数 f [GH2] 特性である。ここで、透過レベルの基準は、電磁干渉抑制体10のがない状態の電磁界強度とした。図23は結合レベル[dB]の開波数 f [GH2] 特性である。ここで、結合レベルの基準は、電磁干渉抑制体100かない状態の磁程殊準をした。

【0092】図24及び図25は、第9月至第11の試 利の電磁干渉抑制効果の開波数特性を示し、図17は透 過レベル [dB] の周波数 「 (GHz) 特性である。こ こで、透過レベルの基準は、電磁干渉抑制体100がな い状態の電電料験度とした。図25は結合レベル [d B] の周波数 [GHz] 特性である。ここで、結合レ ベルの基準は、電磁干渉抑制体100かない状態の電磁 限軸を1.75

【0093】図22及び図23からも判るように、導体 (鋼筒板) のみの場合 (第3の比較試料) では、透過レ ベルは大幅に低下 (-50dB以下) するものの、結合 レベルが強大 (+7dB) してしまい問題である。

【0094】一方、第4の比較試料の軟磁性で形状異方性のほとんどない球状鉄約をゴムに分散させたものでは、結合レベルが低下(一0dB)する傾向を示しているものの、透過減衰がほとんどなく(透過レベルが約一1dB)、干渉時期の効果がほとんどない。

【0095】第3及び第4の比較試料の電盤干渉抑制体100億第9万差第170截料。 たわいては、図24、図25からも明白なように、透過レベルが十分低く(-39dB以下)なっているとともに、結合レベルも増大することがたい(+16RU下)。

【0096】これは、たとえば、電子部品をプリント記 総基板等に実験する電子機器等において、電子部品の下 而とプリント配解基板との間に、電低干渉車制体を配置 することによって、不要輻射による反射の影響を受ける ことなく、電磁干渉を効果的に抑制することが可能とな る。

【0097】したがって、電電干渉抑制体100は不要 電磁波の反射を増大させることなく、相互干渉の抑制の 制御が可能となる。また、電電干渉抑制体100は薄板 であるため、ノイズを抑制するための部品を含めた電子 装置全体として考えると、従来より小形かつ軽量で、 破な電子装置が得られる。たち、電磁干渉抑制体100 は、その構成要素がらわかるように、容易に可能性をも たせることが可能であり、複雑な形状への対応や厳し耐 揺動吟・衝撃災への対応が同能である。 17

【0098】次に、本発明の電磁干渉抑制体100を能動素子及び受動素子等の実装部品の周囲を覆った場合を 銀定した混成集積回路素子への電磁干渉抑制効果について 説明する。 組成を有する第10絶縁性軟磁性体層及び第2の絶縁性 軟磁性体層を下記表7に示す第7の組成を導電性支持体 1の両側に前記スラリー浸漬後に付着させて得た。 【0100】

18

【0099】 [第12の試料] 下記表6に示すの第6の 【表6】 **〈第6の組成**〉

偏平状軟磁性体微粉末	9 0	重量部
組 成:Fe-Al-Si合金		
平均粒径: 1 0 μm		
アスペクト比:>5		
有機結合剤		
ポリウレタン樹脂	8	重量部
硬化剤 (イソシアネート化合物)	2	重量部
抗菌剤		
銀系無機抗菌剂	0.	5重量部
溶剤 (シクロヘキサノンとトルエンとの混合物)	4 0	商量產
エチルセルソルブ	6 5	重量部

【0101】 【表7】

<第7の組成>

導電性支持体 銀獲粉末 平均粒径:3μm	90重量部
有機結合剤 ポリビニルブチラール樹脂	4重量部
硬化剤(イソシアネート化合物)	1 重量部
溶剤 (エチルセルソルプ)	75重量部

【0102】 [第5の比較試料]また、厚さ75μmの ボリイミドフィルムの両面に、導電性支持体1と同じ額 版の銀ベーストをスラリー合浸法によりコーティング し、乾燥、硬化して、厚さ100μmの第5の比較試料 を得た。 【0103】これらの第12の試料及び第5の比較試料 に対して、上記したように、能動素子及び受動素子等の 30 実装部品の周囲を署った電磁環境を想定した電磁干渉血

制体100の特性評価系(図15及び図16に示す試験 装置)を用いて試料が存在しない状態での電磁界強度を 基準として測定をおこなった。

【0104】 図26及び図27にそれぞれ、透過レベル 測定、及び結合レベル測定の結果(周度教持性)を示 す。図26、図27から明かなように、第5の比較試材 では、透過レベルについて、大幅な低下が見られるもの の、結合レベルについては増大する。これに対し、第1 2の試料では透過レベルが大幅に低下し、しかも結合り のつ、以から間的路素子は能水の銀インをコーティング した素子と同様に、十分に電磁波に対する遮蔽効果を有 するとともに、従来の素下に見られたような電磁波の反 射が見られないことがわかる。

[0105]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、電磁干渉抑制効果に更に抗菌性を備えた電磁干渉抑制体を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

50 【図1】本発明の第1の実施の形態による雷磁干渉抑制

体を示す一部断面図である。

【図2】本発明の第2及び第3の実施の形態による電磁 干渉抑制体における導電性支持体の共通の構成を示す一 部断面図である。

19

【図3】本発明の第4の実施の形態による電磁干渉抑制 体における導雷性支持体を示す一部新面図である。

14における毎電性支持体を示り一部断面図である。 【図4】本発明の第5の実施の形態による電磁干渉抑制 体における導雷性支持体を示す一部断面図である。

【図5】本発明の第6の実施の形態による電磁干渉抑制 体を示す一部新面図である。

【図6】本発明の第7の実施の形態による電磁干渉抑制 体を示す一部断面図である。

体を示す一部側面図である。 【図7】図7は本発明の第8の実施の形態による電磁干 渉抑制体を示す一部断面図である。

【図8】本発明の第9の実施の形態による電磁干渉抑制 体を示す一部腑面図である。

【図9】 本発明の第10及び第11の実施の形態による 電磁干渉抑制体における導電性支持体の共通の構成を示 す一部新面図である。

【図10】本発明の第12の実施の形態による電磁干渉 20 抑制体における導電性支持体を示す一部断面図である。 【図11】本発明の第13の実施の形態による電磁干渉

抑制体における導電性支持体を示す一部断面図である。 【図12】本発明の第14の実施の形態による電磁干渉 抑制体を示す一部新面図である。

【図13】本発明の第15の実施の形態による電磁干渉 抑制体を示す一部断面図である。

【図14】図7は本発明の第16の実施の形態による電 磁干渉抑制体を示す一部断面図である。

【図15】本発明の実施の形態による電磁干渉抑制体の 30 効果を検証するための電磁干渉抑制体の特性評価系であ

【図16】本発明の実施の形態による電磁干渉抑制体の 効果を検証するための電磁干渉抑制体の特性評価系であ る。

【図17】第1及び第2の比較試料の電磁干渉抑制効果の周波数特性の内の透過レベル [dB] の周波数 f [GHz] 特性である。

【図18】第1及び第2の比較試料の電磁干渉抑制効果の周波数特性の内の透過レベル [dB] の周波数 f [G 40 Hz] 特性の内の結合レベル [dB] の周波数 f [G H z] 特性を示す図である。

【図19】第1乃至第8の試料の電磁干渉抑制効果の周 波数特性の内で透過レベル [dB] の周波数 f [GH z] 特性を示す図である。 【図20】第1乃至第8の試料の電磁干渉抑制効果の周 波数特性の内で結合レベル [dB] の周波数 f [GH z] 特性を示す図である。

【図21】第1乃至第8の試料,第1及び第2の比較試料の周波数800MHzにおける透過レベル及び結合レベルを失々示す図である。

【図22】第1及び第2の比較試料の電磁干渉抑制効果の周波数特性の内で透過レベル [dB]の周波数 f [GHz] 特性を示す図である。

【図23】第1及び第2の比較試料の電磁干渉抑制効果 の周波数特性の内で結合レベル [dB] の周波数 f [G Hz] 特性を示す図である。

【図24】第9乃至第11の試料の電磁干渉抑制効果の 周波数特性の内の透過レベル [dB] の周波数 f [GH 2] 特性を示す図である。

【図25】第9乃至第11の試料の電磁干渉抑制効果の 周波数特性の内で結合レベル [dB] の周波数 f [GHz] 特性を示す図である。

【図26】第12の試料及び第5の比較試料の電磁干渉 抑制効果の周波数特性の内の透過レベル [dB]の周波 数f [GHz] 特性である。

【図27】第12の試料及び第5の比較試料の電磁干渉 抑制効果の周波数特性の内で結合レベル [dB]の周波 数f [GHz] 特性を示す図である。

【符号の説明】

1 導雷性支持体

絶縁性軟磁性体層

3 軟磁性体粉末

有機結合剤
 絶縁基材

紀塚基村
 導雷性薄膜

7 軟磁性金属薄膜

8 導電性粉末

9 導電体層

10 誘雷体層

1 1 誘電体粉末

20 抗菌層

21 マイクロカプセル

22 合成樹脂

28 電磁界波源用発振器

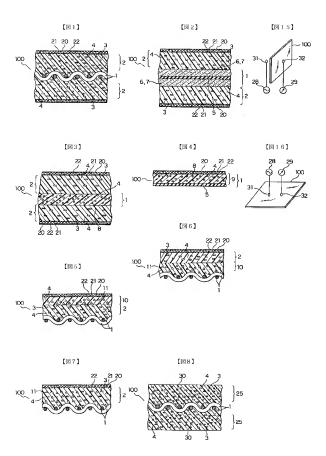
29 電磁界強度測定器(受信用素子)

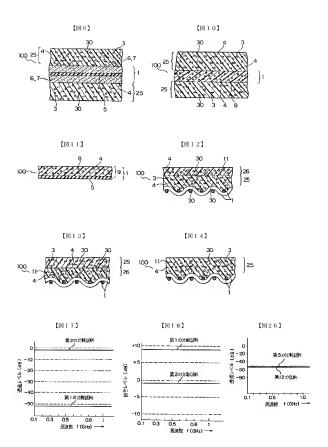
30 抗菌剤

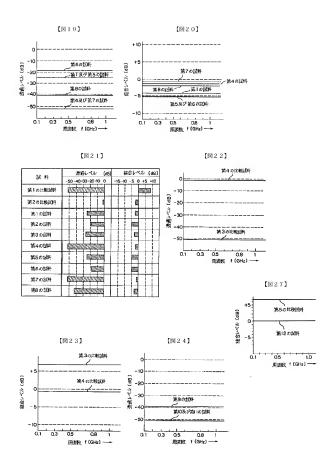
31 電磁界送信用微小ループアンテナ

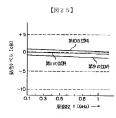
32 電磁界受信用微小ループアンテナ

100 電磁干渉抑制体









フロントページの続き

F ターム(参考) 5E041 AA04 AA07 BB03 CA01 5E058 AA40 5E321 BB21 BB23 BB32 BB41 BB51 BB53 BB60 G605 GG11